

『生産システムを支える画像応用技術』

目 次

1. 講演

- 「光学特性を利用した I T 電子部品の検査・計測技術」…………… 1
日立ハイテク・ファインテック製品事業本部 小泉 光義 氏

2. 講演

- 「ものづくり分野における光学的微細計測技術」…………… 1 1
(株) 富士通研究所
塚原 博之 氏、西山 陽二 氏、高橋 文之 氏、布施 貴史 氏

3. 研究発表

- 「I C パッケージ標印文字識別法の検討
— 一角度テンプレートマッチング法と正規化相関法の比較—」…… 1 9
立命館大学 大学院 理工学研究科 島村 徹 氏
立命館大学 理工学部 石井 明 氏、野方 誠 氏
ローム (株) 清水 誠 氏

4. 報告

- 「第 7 回日仏/第 5 回ヨーロッパ・アジアメカトロニクス会議
—Mecatronics2008 開催報告書—」…………… 2 5
香川大学 秦 清治 実行委員長

5. 報告

- 「第 3 回アジアメカトロニクス国際シンポジウム報告」…………… 2 7
北海道大学 田中 孝之 実行委員長
電気通信大学 明 愛国 プログラム委員長

6. 報告

- 「外観検査アルゴリズムコンテスト 2 0 0 8」…………… 2 9
徳島大学 寺田 賢治 実行委員長

今回担当委員：

肥塚委員 (富士通)、加藤委員 (中部大)、北川委員 (東レエンジニアリング)、
糊澤委員 (旭硝子)、石井委員 (立命館大)、梶谷委員 (電通大)、
中野委員 (日本 I B M)、野村委員 (ファースト)、秦委員 (香川大)